

## 波長分散型蛍光X線分析システム（上面型）

### ■機器の概要

試料にX線を照射し発生する蛍光X線を測定することで、主にセラミックス、金属、樹脂等に含まれる元素の定性分析・定量分析を行うことができます。波長分散型のため精度の高い測定結果が得られ、真空中で試料の上面からX線を照射できることから、様々な形態の試料（粉末・固体）に対応することができます。

### ■活用事例

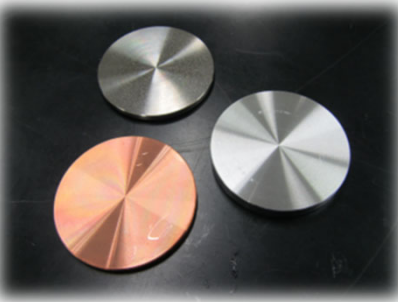
#### <セラミックスの成分分析>

粉末試料を加圧成形して測定します。

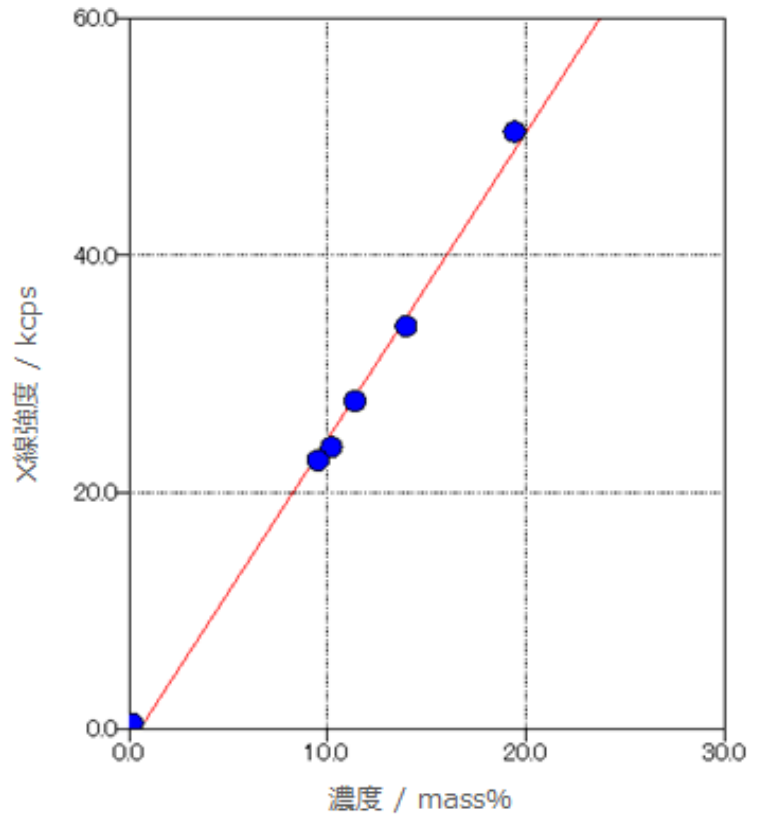


#### <金属の成分分析>

金属試料の表面を研磨して測定します。



ステンレス鋼に含まれるニッケルの検量線



### ■仕様・留意事項

#### 主な仕様

- ・型式 : ZSX Primus IV
- ・メーカー : (株)リガク (日本)
- ・X線管 : 高輝度 4kW Rhターゲット
- ・照射方式 : 上面照射 (試料の上側からX線を照射)
- ・測定元素 : Be~U
- ・測定試料 : 粉末・固体 (セラミックス、金属、樹脂)
- ・測定雰囲気 : 真空 (真空度安定化機構)

